

平成 23 年 11 月 16 日

平成 23 年度 第 2 回分析技術講習会基礎コース

新潟県工業技術総合研究所
下越技術支援センター

製品開発・製造・販売において、クレームや製造トラブルの原因究明に分析は必要不可欠になっています。しかしながら、分析手法にもいくつかあり、得られる情報も異なるためその選択は難しいものがあります。また、原理や使用方法も最初のうちはなかなか理解するのが難しいところがあります。

弊センターでは利用頻度の高い化学系の分析装置に関して以下のとおり初心者向けの分析技術講習会を企画しました。

これまで、クレーム処理や製品トラブルで困っている企業の方や、分析装置の操作方法を習得してみたかった技術者の方に有用な内容になっています。ふるってご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

なお、本講習会は第 1 回目と同じ内容です。

記

日 時 平成 23 年 12 月 14 日 (水) 13:00～17:00
場 所 新潟県工業技術総合研究所 3 階 301 会議室 (および実験室)
〒950-0915 新潟市中央区鏡西 1-11-1 (新潟駅から徒歩 15 分)
URL: <http://www.iri.pref.niigata.jp>
内 容 次頁にセミナー次第 (詳細) を載せましたのでご覧ください。
* 分析基礎コース解説
(1) 蛍光 X 線 (XRF)
(2) プラズマ発光分光分析 (ICP)
(3) 赤外分光分析 (FTIR)
* 分析実習 (蛍光 X 線、ICP、FTIR の 3 手法の巡回実習)
定 員 15 名
受講料 無料
申込方法 参加申込書にご記入いただき、12 月 7 日までに FAX またはメールでお申し込みください。

平成 23 年度 第 2 回分析技術講習会基礎コース 参加申込書

申込先: 下越技術支援センター 永井 宛

FAX: 025-241-5018 e-mail: nagai@iri.pref.niigata.jp

貴社名	住所	
TEL	FAX	
役職	氏名	E-mail アドレス

* ご記入いただいた個人情報は、本分析講習会に関する連絡以外には使用いたしません。

講習会次第

- 13:00～13:05 受付
13:05～13:10 あいさつ
13:10～14:40 分析基礎コース解説
1. 蛍光 X 線分析 (XRF)
下越技術支援センター 主任研究員 岡田英樹
元素の組成分析を行うのに有効な蛍光 X 線分析の原理および応用例について紹介します。
 2. プラズマ発光分光分析 (ICP)
下越技術支援センター 研究員 渡邊 亮
金属や樹脂中の微量成分分析を行うのに有効な ICP の原理および適用例について解説します。
 3. 赤外分光分析 (FTIR)
下越技術支援センター 主任研究員 天城裕子
有機材料の同定や劣化状態などの解析に有効な FTIR の原理および適用例について解説します。
- 14:40～14:55 休憩
14:55～16:55 分析実習 (蛍光 X 線、ICP、FTIR に関して巡回して実習を行います)
16:55～17:00 質疑応答

※問い合わせ先：新潟県工業技術総合研究所下越技術支援センター 永井 TEL:025-244-9168

